



## Colloquium Optische Spektrometrie (COSP), Jena, 26.-27. September 2022

### Programm *Stand 2022\_09\_14*

#### Montag, 26. September 2022

<b>13:00</b>	<b>Registrierung</b>	
13:30	Begrüßung PerkinElmer	Guido Lohkamp-Schmitz, PerkinElmer LAS (Germany) GmbH, D-63110 Rodgau
13:45	Begrüßung IOF	Sven Schröder, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena
14:05	Aktuelles zur UV/Vis/NIR Spektrometrie	Ivo Stemmler, PerkinElmer LAS (Germany) GmbH, D-63110 Rodgau
14:35*	State of the art in UV/Vis/NIR spectroscopy	Serge Timmermans, OMT solutions b.V., NL-5656AE Eindhoven
<b>15:05</b>	<b>Pause</b>	
15:35*	Variable Angle Spectroscopy	Peter van Nijnatten, OMT solutions b.V., NL-5656AE Eindhoven
15:55	18 Jahre OIC Measurement Problem – Eine praktische Messunsicherheitsbetrachtung zur Spektralphotometrie und Ellipsometrie	Marcus Trost, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena
16:15	18 years OIC measurement problem – How to extend optical spectrometry for ultra-high reflectance and ultra-low absorption measurements?	Christian Mühlig, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena
16:35*	Angular scattering and BRDF, BTDF measurements	Peter van Nijnatten, OMT solutions b.V., NL-5656AE Eindhoven
16:55	Messung lichtstreuender Proben	Ivo Stemmler, PerkinElmer LAS (Germany) GmbH, D-63110 Rodgau

#### Abendprogramm

- 18:30 Planetarium: „Queen in Heaven“
- 19:45 Abendessen im Hotel Restaurant Schwarzer Bär

\* = Vortragssprache Englisch



## Dienstag, 27. September 2022

09:30	Begrüßung	
09:35	Winkelabhängige Transmission und Reflexion	Ivo Stemmler, PerkinElmer LAS (Germany) GmbH, D-63110 Rodgau
09:55	Spektralfotometrische Charakterisierung von Einzelschichten unter Nutzung des VN-Prinzips: Routine oder mehr?	Steffen Wilbrandt, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena
10:15	Spektralphotometrische Charakterisierung ultradünner Aufdampf-Metallschichten	Olaf Stenzel, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena
10:35	All-in-one monitoring and machine control of not only optical coatings with MOCCA+ (Modular optical coating control application)	Stefan Bruns, Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, D-38108 Braunschweig
10:55	Off-Axis Messungen von Antireflex-Schichten auf Mikroskoplinsen	Frank Eisenkrämer, Leica Microsystems CMS GmbH, D-35578 Wetzlar
<b>11:15</b>	<b>Pause</b>	
11:45	Temperaturabhängige UV-vis-NIR Spektroskopie in diffuser Reflexion and FIR-MIR Spektroskopie in ATR-Technik zur Charakterisierung thermo- and magnetochemischer Verbindungen	Peter Weinberger, TU Wien, A-1060 Wien
12:05	Broadband absorber optimization using UV-NIR spectrometer	Mario Ziegler, Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V., Kompetenz-Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien (KMNT), D-07745 Jena
12:25	Optische Charakterisierung plasmonischer TiN Nanolochgitter für CMOS-kompatible integrierte Brechungsindexsensoren	Sebastian Reiter, Brandenburg Technical University Cottbus-Senftenberg, D-03046 Cottbus
<b>12:45</b>	<b>Pause</b>	
13:45	Einblicke in die Kinetik der Perowskitbildung durch optische und strukturelle In-situ-Spektroskopie	Florian Mathies, Helmholtz, Solution Processing of Hybrid Materials & Devices, D-12489 Berlin
14:05	Spektrale Eigenschaften und LIDT Charakteristika von hochabsorbierendem und diffus reflektierendem Sol-Gel Quarzglas	Robert Brunner, Ernst-Abbe Hochschule Jena, D-07745 Jena
14:25	Multivariate data analysis in polymer spectroscopy	Márton Bredács, Polymer Competence Center Leoben GmbH, A-8700 Leoben
14:45	Richtig messen im mittleren Infrarot, Konzept für absolute Genauigkeit im FTIR-Spektrometer mit dem Spectrum 3 Optica	Patrick Müller, PerkinElmer LAS (Germany) GmbH, D-63110 Rodgau
<b>15:05</b>	<b>Ende</b>	